

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

НАНОМЕТРОЛОГИЯ

28.03.02 Наноинженерия

6 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических основ нанометрологии и современных методов обеспечения единства наноизмерений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Нанометрология» относится к циклу (разделу) Б1.Б.27 (дисциплины базовой части ОПОП).

Для успешного изучения дисциплины «Нанометрология» студенты должны быть знакомы с такими дисциплинами, как «Метрология, стандартизация и технические измерения», «Электроника», «Физика», «Физико-химические основы нанотехнологии». Освоение дисциплины «Нанометрология» требуется для последующего изучения дисциплин «Методы диагностики в нанотехнологиях», «Испытание изделий».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1. Способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и услуг, приёмку и учёт товаров по количеству и качеству:

знать:

категорийный аппарат товароведения и методы управления ассортиментом и качеством товаров; ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию укрупнённого ассортимента потребительских товаров. Факторы их обеспечивающие; правила и методику приёмки и учёта товаров по количеству и качеству.

уметь:

управлять ассортиментом, оценивать, контролировать и управлять качеством товаров, учитывать формирующие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных документов.

владеть:

навыками работы с товарами разного назначения, а также с нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению соответствия обязательным требованиям.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение и терминология.

Тема 2. Техническое обеспечение нанометрологии.

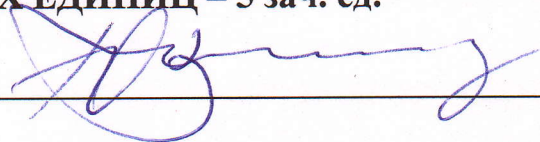
Тема 3. Современные технологии обеспечения единства наноизмерений.

Тема 4. Организационная структура обеспечения единства наноизмерений в РФ.

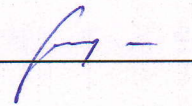
5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - экзамен

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ – 5 зач. ед.

Составитель: доцент Ю.И. Захаров

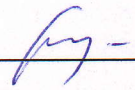


Заведующий кафедрой «Технология машиностроения» В.В. Морозов



Председатель

учебно-методической комиссии направления В.В. Морозов



Декан МТФ



А.И. Елкин

Дата: 14.01.2016г.

Печать

